

Índice General

Resumen	3
Abstract	5
Abreviaturas	7
Índice General.....	9
Índice de Figuras.....	13
Capítulo 1.....	19
1. Introducción General	19
1.1. Introducción	20
1.2. Material en estudio: Características y propiedades generales de la circonia.....	22
1.2.1. Polimorfismo de la circonia.....	23
1.2.2. Transformación de fases en la circonia.....	25
1.2.3. Retención de fases de alta simetría	27
1.2.3.1. Retención de fases de alta simetría por tamaño de grano	27
1.2.3.2. Retención de fases de alta simetría por dopado.....	28
1.2.4. Mejora de la tenacidad por retención de la fase tetragonal	29
1.3. Películas delgadas en base circonia	30
1.3.1 Proceso sol-gel	31
1.3.2 Depósito por dip-coating.....	33
1.4. Objetivos generales de la tesis.....	34
1.5. Principales contribuciones de esta tesis	35
Capítulo 2.....	37
2. Procedimiento experimental	37
2.1. Preparación de los materiales.....	38
2.1.1. Proceso para la obtención de películas delgadas	38
2.2. Técnicas de caracterización.....	41
2.2.1. Difracción de Rayos X (XRD)	41
2.2.2. Difracción de Rayos X con incidencia rasante (GIXRD)	44
2.2.3. Difracción de Rayos X a alta temperatura (HT-XRD)	46
2.2.4. Refinamiento Rietveld.....	46
2.2.5. Microscopía electrónica de Barrido (SEM) y Espectroscopia dispersiva en Energía (EDS)	48
2.2.6. Microscopía electrónica de Transmisión (TEM)	49
2.2.7. Espectroscopia Raman (RS)	50
2.2.8. Microscopía de Fuerza Atómica (AFM)	53

2.2.9. Mediciones de resistividad eléctrica (ρ).....	54
2.2.10. Mediciones de dureza y adherencia	55
Parte I Películas delgadas de ZrO ₂	59
Capítulo 3.....	61
3. Síntesis y caracterización de películas delgadas de ZrO ₂ obtenidas mediante el Método Sol-Gel.....	61
3.1 Introducción	62
3.2 Metodología experimental.....	63
3.2.1 Preparación de soles	63
3.2.2 Obtención de polvos	64
3.2.3 Preparación de Películas delgadas	64
3.2.4 Técnicas de caracterización.....	65
3.3 Caracterización de polvos y películas obtenidas mediante la síntesis S1	66
3.3.1 Propiedades cristalográficas de los polvos S1.....	66
3.3.2 Caracterización de películas delgadas S1.....	69
3.4 Caracterización de polvos y películas obtenidas mediante la síntesis S2	72
3.4.1 Propiedades cristalográficas de los polvos S2.....	72
3.4.2 Caracterización de películas delgadas S2.....	77
3.5 Comparación de rutas de síntesis S1 y S2	80
3.6 Conclusiones del capítulo.....	81
Capítulo 4.....	83
4. Estudio del proceso de cristalización de películas delgadas de ZrO ₂	83
4.1. Introducción	84
4.2. Metodología experimental.....	84
4.2.1 Preparación de las películas delgadas.....	84
4.2.2 Caracterización de las películas delgadas	85
4.3. Resultados	87
4.3.1 Estudio <i>in-situ</i> del proceso de cristalización	87
4.3.1.1 Calentamiento	88
4.3.1.2 Temperatura máxima.....	91
4.3.1.3 Enfriamiento.....	92
4.3.2 Efecto de la temperatura máxima del tratamiento térmico.....	95
4.3.2.1 Efecto sobre la microestructura de las películas delgadas	95
4.3.2.2 Efecto sobre la morfología y rugosidad de las películas delgadas	98
4.4. Conclusiones del capítulo.....	101
Capítulo 5.....	103

5.	Estudio de películas de ZrO ₂ depositadas en sustratos de Zircaloy-4	103
5.1	Introducción	104
5.2	Metodología experimental.....	105
5.2.1	Preparación de muestras	105
5.2.2	Caracterización mediante SEM	106
5.2.3	Caracterización a través de GIXRD	107
5.2.4	Mediciones de propiedades mecánicas	107
5.2.5	Mediciones de conductividad	108
5.3	Estudio del espesor de las películas depositadas en Zircaloy-4.....	109
5.4	Estudio de las propiedades cristalográficas de los óxidos formados en Zry-4.....	111
5.4.1.	Calculo del espesor a partir de GIXRD.....	119
5.5	Estudio de propiedades mecánicas de óxidos formados en Zircaloy-4	121
5.5.1	Mediciones de dureza Vickers.....	121
5.5.2	Adherencia de los óxidos formados	125
5.6	Estudio de propiedades eléctricas	127
5.7	Conclusiones del capítulo.....	128
	Parte II Películas delgadas de YSZ.....	131
	Capítulo 6.....	133
6.	Síntesis y caracterización de películas delgadas de YSZ.....	133
6.1	Introducción	134
6.2	Metodología experimental.....	136
6.2.1.	Preparación de películas de 8YSZ.....	136
6.2.2.	Caracterización	137
6.3	Caracterización <i>ex-situ</i> de películas delgadas de 8YSZ.....	139
6.4	Caracterización <i>in-situ</i> de películas delgadas de 8YSZ	142
6.4.1.	Estudio del proceso de cristalización durante el tratamiento térmico de la película delgada.....	142
6.4.2.	Propiedades cristalográficas de la película cristalizada	149
6.4.3.	Conductividad de película cristalizada	149
6.5	Conclusiones del capítulo.....	151
	Capítulo 7.....	153
7.	Conclusiones generales y perspectivas futuras	153
7.1	Conclusiones generales	155
7.2	Perspectivas futuras	157
	Apéndice A.....	159

A. Comportamiento a la corrosión de placas de Zircaloy-4 con espesor de óxido controlado mediante recubrimiento por dip-coating y tratamientos térmicos	159
A.1 Objetivo	160
A.2 Muestras estudiadas	160
A.3 Ensayo realizado.....	161
A.4 Resultados y discusión	161
A.5 Conclusiones.....	164
Referencias	167
Publicaciones realizadas en el marco de esta tesis	182
Agradecimientos.....	185